



中华人民共和国国家标准

GB/T 46482—2025

LED/LD 用稀土荧光片

Rare-earth phosphor film for LED/LD

2025-10-05 发布

2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)提出并归口。

本文件起草单位：江苏博睿光电股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、厦门大学、厦门稀土材料研究所、江西理工大学、包头稀土研究院、有研稀土高技术有限公司、内蒙古稀土功能材料创新中心有限责任公司。

本文件主要起草人：梁超、谢士会、吴斌、刘玉洁、陈晓霞、解荣军、李淑星、宋立军、林福霖、李燕、刘和连、刘波、王忠志、张霞、郭钟楷、李凯、廉毅洁、杨鹏宇、蒙丽娟。

LED/LD 用稀土荧光片

1 范围

本文件规定了 LED/LD 用稀土荧光片的牌号和牌号表示方法、技术要求、检验规则和包装、标志、运输、贮存及随行文件,描述了相应的试验方法。

本文件适用于经热处理制得的稀土荧光片,主要用于制备由蓝光 LED/LD 芯片激发的白光或特定颜色 LED/LD 发光器件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 5838.1 荧光粉 第 1 部分:术语
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 23595.3 LED 用稀土荧光粉试验方法 第 3 部分:色品坐标的测定
- GB/T 23595.4 LED 用稀土荧光粉试验方法 第 4 部分:高温高湿性能的测定
- GB/T 23595.7 LED 用稀土荧光粉试验方法 第 7 部分:热猝灭性能的测定
- GB/T 23595.8 LED 用稀土荧光粉试验方法 第 8 部分:高压加速老化性能的测定
- GB/T 24982 白光 LED 用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉
- GB/T 32642 平板显示器基板玻璃表面粗糙度的测量方法
- GB/T 36356 功率半导体发光二极管芯片技术规范
- GB/T 39492 白光 LED 用荧光粉量子效率测试方法

3 术语和定义

GB/T 5838.1 和 GB/T 24982 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

稀土荧光片 rare-earth phosphor film

由稀土荧光粉或稀土荧光粉和无机非金属粉体材料通过热处理得到荧光块材,再经切割、研磨或抛光、划片等加工工序制得的片状产品。

3.2

孔洞 hole

稀土荧光片表面存在的孔隙或坑洞缺陷。

3.3

崩边 chipping

稀土荧光片边缘存在的破损。

3.4

裂纹 crack

稀土荧光片表面的狭长缝隙缺陷。